J-PARC ミュオンキッカーシステムの現状

STATUS OF MUON KICKER SYSTEM AT J-PARC

寛^{#, A,B)}、入江吉郎^{A,B)}、パトリック ストラッサー^{A,B)}、坂田茂雄^{C)}、目黒 学^{C)}、 藤森 長友 傑^{A,B)},小嶋健児^{A,B)},三宅康博^{A,B)}

Hiroshi Fujimori ^{#, A,B)}, Yoshiro Irie ^{A,B)}, Patrick Strasser ^{A,B)}, Shigeo Sakata ^{C)}, Manabu Meguro ^{C)},

Takashi Nagatomo^{A,B)}, Kenji Kojima^{A,B)}, Yasuhiro miyake^{A,B)}

^{A)} Muon Science Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{B)} Muon Science Section, Material and Life Science Division, J-PARC center

2-4 Shirakata Shirane, Tokai-Mura, Naka-Gun, Ibaraki 319-1195

^{C)} Nippon Advanced Technology Co. Ltd. (NAT)

3129-45 Muramatsu Hibara, Tokai-Mura, Naka-Gun, Ibaraki, 319-1112

Abstract

The muon kicker system is used to separate the muon pulses and feed them to two experimental areas (D1, D2) simultaneously. Beam operation with the kicker system started in winter 2011. Dividing the muon beam into two singlepulsed beams was successful, but anti-noise measures were required. Later, the kicker noise level was drastically improved through refining both the ground lines of the kicker system and the detectors. Figure 1 shows ue-decay spectra with kicker on/off. However, the kicker noise level is still high according to the S/N ratio of some detectors. Further measures to reduce the kicker noise are contrived. On the other hand, the reduction in the rise time of the kicker current for high-intensity beams with longer bunches is in progress.

はじめに 1.

J-PARC 物質生命科学実験施設における崩壊ミュ オンビームラインには、二重化パルスミュオンビー ム(ダブルパルスミュオン)を二つのシングルパル スに分別し同時に二つの実験エリアに供給するため、 2011 年夏にミュオンキッカーシステムが導入され、 当該システムを用いての運転が同年冬に開始された。 運用当初は検出器に乗るキッカーノイズの影響が大 きく、ほとんど実験にならない状況にあったが、 キッカー本体側および検出器側、双方の遮蔽および GND 対策によって、一部の検出器において実験が 可能になるまでノイズが低減した(図1)。現在、 ノイズ遮蔽の強化を施し、ノイズレベルをさらに下 げる対策を講じる一方、ビーム強度の増強に対応す るためキッカー波形の立ち上がり時間の短縮改善を 進めている。

放射ノイズ遮蔽 (RF Shield) 2.

図 1 は光電子増倍管を用いた陽電子検出器(DΩ1 Spectrometer)におけるキッカーon/offによる出力信号 (µe-decay spectra) を示す。上段はダブルパルス、 中段はキッカーを用いた最初のシングルパルス取り 出しにおけるトレースである。一方、下段はキッ カーシステムのアースライン整備後のトレースであ り、中段(アースライン整備前)に比べ劇的なノイ ズ低減が見られる。ue-decay の検出器については、 アースラインの整備およびカウンタ信号の閾値

(threshold) の調整によって、キッカーシステムを 用いたシングルパルス実験が可能となったが、シグ ナルが小さく且つノイズに弱い検出器については、 更なるノイズ低減対策が必要である。



図1: 検出器の出力信号(µe-decay spectra)

検出器に生ずるノイズ源として最も疑わしいのは、 キッカー電源、キッカー電磁石および出力ケーブル からの放射ノイズである。前回、放射ノイズが強い 部分には銅板による遮蔽を施したが、期待通りの効 果が確認できなかった。そこで今回、図 2a のよう な出力端子の遮蔽強化、および図 2b のようにアル ミ製の箱状ケーブルラック(カバーラック)中に収 納敷設された出力ケーブルをカバーラックの上から 経路全体(キッカー電源出力端子から負荷電力端子) を覆うノイズ遮蔽(RF Shield)が施された。

[#] fujimori@post.kek.jp



図 2a:キッカー出力端子の遮蔽 遮蔽強化後(左)および遮蔽強化前(右)





さらに、キッカー電磁石が2台挿入されたビーム ライン上の真空槽(キッカー真空槽)にも厚さ2mm のアルミ製の遮蔽が図3のようにビームラインのコ ンクリート遮蔽体との狭いスペースに設置された。 一連の遮蔽強化を施した後、その遮蔽効果を確認す るため、主要箇所において空間ノイズの測定が実施 された。測定には前回同様、同軸ケーブルの先に サーチコイルを取り付けた簡単な Radio Wave Detector [1]が用いられた。キッカーシステム周り主 要箇所の放射ノイズ分布を図4に示す。



図 3:キッカー真空槽の遮蔽 遮蔽処置後(左)および遮蔽処置前(右)

今回の遮蔽強化により、全体的にノイズレベルは 低減し、前回高めだった負荷側、特にキッカー真空 槽の上部(図中 12~17)について顕著な(~1/100) ノイズ改善がみられた。また、前回ノイズの影響が 大きく本来の信号を確認できなかった Area-D2 検出 器(ミュオニウム実験用陽電子カウンタ)に発生す るノイズレベルについては実験可能なレベル(5mV 以下)まで軽減された。





図4:キッカーシステム周りのノイズ分布 測定ポイント(上)およびノイズレベル分布(下)

検出器のノイズレベル低下は、遮蔽対策と同時に 行った検出器信号ケーブルへのジッパーチューブ (日本ジッパーチュービング社製)用いた遮蔽およ び GND 処理も効果的であった。放射ノイズは検出 器の信号ケーブルを媒体としてノイズを発生させる 場合も考えられ、ノイズ源の低減と同時に検出器側 の対応(ノイズを受け難くする対策)が必要である。

3. 励磁波形の立ち上がり時間短縮改善

3.1 インダクタンスの軽減

立ち上がり時間を短くするには、負荷のインダク タンスを小さくすることが効果的である。最初の キッカー電磁石の磁極は厚さ 50mm のコの字型フェ ライトを向かい合わせて長さ方向に 8 組(400mm) 並べた構造である。これらの内 2 組(4 個)だけ間 引いて、長さ方向に 6 組(300mm)の磁極を形成す る。間引き数については、テフロンコアを用いた R&D [2]により最適化したものである。図 5 はフェ ライトコア 6 組を用いた磁極および組み立て後の キッカー電磁石1号機(改造後)を示す。



図 5:キッカー電磁石 1 号機 フェライトコア磁極(左)および改造後(右)

改造前後の電気特性試験を実施し、両者の比較検 討を行った。このときのフェライトコア数に対する インダクタンスの関係を表1に示す。実測値と計算 値は3並列のフィードスルーおよび1(m)×3並列 同軸ケーブル(FT+3Cables)を除いた電磁石(M) のみの値である。

表1:インダクタンス比較(LCRメータ 500kHz)

Ferrite	FT+3Cables+M	実測値	計算値
組	μΗ	μΗ	μΗ
8	1.47	1.16	1.12
6	1.14	0.94	0.85

改造前(Ferrite 8 組)に対し、
ひ着後(Ferrite 6 組)
のインダクタンスは約 20%
20%
経減された。

3.2 磁場測定

改造後のキッカー磁場を確認するため、サーチコ イルを用いて実際のパルス励磁における磁場を図 6 のような回路[3]を介して、電磁石の中心磁場および 中心軌道に沿った磁場分布を測定した。サーチコイ ルは直径 20mm のガラスエポキシ製の円柱に 0.7mm のエナメル線を 10 ターン巻いたものを用いた。コ イルからツイスト状に撚ってフィードスルーを介し て RC の積分回路を通し、信号をオシロスコープで 観察する。図 7 にコイル電流の CT 波形およびサー チコイルに発生した誘導起電力を積分回路に通した 波形(積分波形)を示す。



図 6:積分回路の概略(左) および測定に用いたサーチコイル(右)

図中、上段は CT 波形であり、青線は改造前(磁 極長 400mm)の励磁波形、黒線は改造後(磁極長 300mm)の励磁波形を示す。下段はサーチコイル起 電力の積分波形であり、同様に青線は改造前の励磁 波形、黒線は改造後の励磁波形を示す。ピークのず れは充電電圧の差であるが、改造前後を比較したと き改造後の立ち上がり時間の改善(5-95%において、 368ns→315ns)が確認された。



図7:CT 波形およびサーチコイルの誘導起電力に よる積分波形(青:改造前、黒:改造後)

電磁石中に置かれたサーチコイルに発生した誘導 起電力 V は、コイルの巻き数 N=10Turns、半径 r=10mm (S= π r²) として次のよう導かれ、積分回路 を通して得られた Vc を測ればピーク磁場 B が求め られる。

$$V = N \frac{d\emptyset}{dt} = N \frac{d(BS)}{dt} = NS \frac{dB}{dt}$$
$$B = \frac{1}{NS} \int V dt = \frac{RC}{NS} Vc , \left(Vc = \frac{1}{RC} \int V dt\right)$$

実際には R=110Ω、C=324nF を入れて、40kV (5380A) 励磁のとき 280Gauss が得られた。サーチ コイルを磁石中心に固定し、フィードスルーを介し て配線すれば、真空中での測定が可能であるため、 中心磁場については真空中において 0~40kV までの 測定が実施された(図 8)。



充電電流 0~40kV において直線性がよく、飽和は 見られない。期待通りの結果が得られた。一方、中 心軌道の磁場分布は、サーチコイルをビーム方向へ 移動させながら測定する必要があるため、放電の観 点から大気中における低電圧での測定に限られる。 そこで、充電電圧 5kV において中心軌道の染み出し 磁場 (fringe field)の影響を調べた。図 9 に測定結 果を示す。z=0 は電磁石の中心であり、赤枠は fringe field を考慮した BL 積に相当する。磁極長が 300mm であることから、両側で 100mm 程度の fringe field が存在することが分かる。



図 9: 中心軌道の磁場分布 (fringe field)

4. まとめ

4.1 ノイズ対策

遮蔽効果により全体としてノイズレベルが減少し、 検出器側の対策(信号ケーブルの遮蔽、GND処理) の相乗効果により、今までノイズレベルが高過ぎて 本来の信号を確認できなかった検出器において信号 を確認できるレベルまでノイズが軽減した。ただし、 実験に用いるためには、今一歩のノイズ対策が必要 である。キッカーシステムの絶縁、GNDの強化お よび検出器側の対応等、複合的な対策が必要と思わ れる。

4.2 立ち上がり時間の改善

インダクタンス軽減の観点から磁場長(磁極長) を短くすることにより、立ち上がり時間の改善を 図った。すなわち、磁極に用いられているフェライ トコアの間引きにより、磁極長を 400mm から 300mm に短縮し、インダクタンスは 20%減少した。 これによって、立ち上がり時間は約 15% 短縮改善 された。

4.3 今後の予定

・キッカーシステムの絶縁対策として、キッカー電磁石が収納された真空槽(キッカー真空槽)と電気的につながっている個所、すなわち、キッカー真空槽前後のビームダクトおよび架台との絶縁処理を行うと共に、検出器側の信号ケーブルおよびGND処理を強化し、さらなるキッカーノイズの

低減を図る。

 ・励磁波形立ち上がり時間改善について、キッカー 電磁石2号機においても1号機同様の改造が実施 され、シャットダウン中にインストールを計画し ている。その際、サーチコイルと積分回路を用い た磁場測定を実施し、1号機との比較を行う予定 である。

参考文献

- [1] H. Fujimori et al., KEK-MSL Report 2011 (2012) 9
- [2] H. Fujimori et al., Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (8-11 August, 2012, Toyonaka, Japan)
- [3] H. Fujimori, et al., Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, August 1-3, 2011, Tsukuba, Japan